

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1922 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319 της 14ης Δεκεμβρίου 2018)

Στη σελίδα 129, στο σημείο 3B001. στ, η στοίχιση των σημείων 3 και 4 τροποποιείται ως εξής:

- αντί: «3. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιαστεί για την παραγωγή μασκών με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- α. Εκτρεπόμενη εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων, δέσμη ιόντων ή δέσμη «λείζερ» και
 - β. Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 - 1. Μέγεθος κηλίδας μισό του μεγίστου και με πλήρες πλάτος (FWHM) μικρότερο των 65 nm και θέση εικόνας μικρότερη των 17 nm (μέσο σφάλμα + 3 σίγμα)· ή
 - 2. Δεν χρησιμοποιείται·
 - 3. Σφάλμα επίστροφης δεύτερου επιπέδου μικρότερο από 23 nm (μέσο σφάλμα + 3 σίγμα) επί της μάσκας·
 - 4. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιαστεί για επεξεργασία συσκευών με τη χρήση μεθόδων άμεσης εγγραφής και έχει όλα τα ακόλουθα:
 - α. Εκτρεπόμενη και εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων· και
 - β. Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 - 1. Ελάχιστο μέγεθος δέσμης ίσο ή μικρότερο από 15 nm· ή
 - 2. Σφάλμα επικάλυψης μικρότερο από 27 nm (μέσος όρος + 3 σίγμα)·
- διάβαζε: «3. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιαστεί για την παραγωγή μασκών με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- α. Εκτρεπόμενη εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων, δέσμη ιόντων ή δέσμη «λείζερ» και
 - β. Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 - 1. Μέγεθος κηλίδας μισό του μεγίστου και με πλήρες πλάτος (FWHM) μικρότερο των 65 nm και θέση εικόνας μικρότερη των 17 nm (μέσο σφάλμα + 3 σίγμα)· ή
 - 2. Δεν χρησιμοποιείται·
 - 3. Σφάλμα επίστροφης δεύτερου επιπέδου μικρότερο από 23 nm (μέσο σφάλμα + 3 σίγμα) επί της μάσκας·
 - 4. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιαστεί για επεξεργασία συσκευών με τη χρήση μεθόδων άμεσης εγγραφής και έχει όλα τα ακόλουθα:
 - α. Εκτρεπόμενη και εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων· και
 - β. Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 - 1. Ελάχιστο μέγεθος δέσμης ίσο ή μικρότερο από 15 nm· ή
 - 2. Σφάλμα επικάλυψης μικρότερο από 27 nm (μέσος όρος + 3 σίγμα)·
-